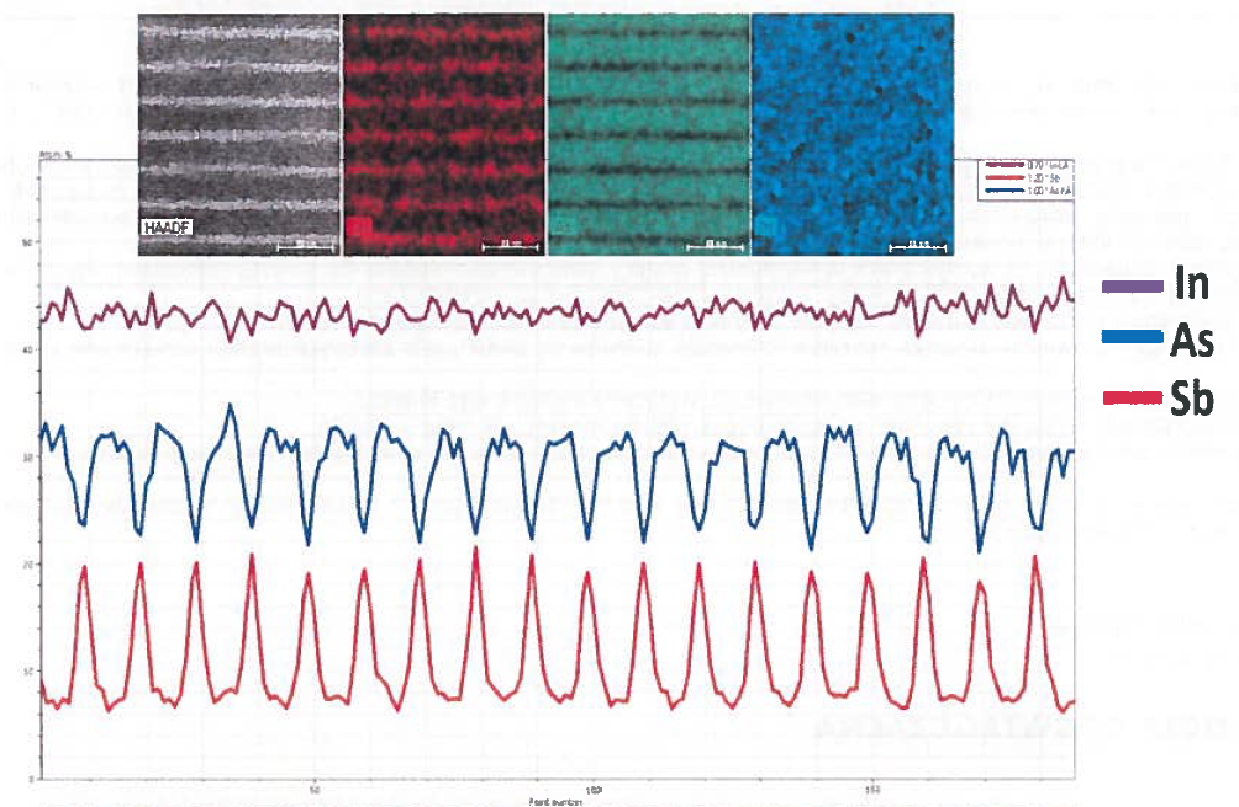
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscopy) z wykorzystaniem mikroskopu z podwójną korekcją abberacji sferycznej wyposażonego w układ detektorów EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz detektor HAADF (High-angle annular dark-field). Próbki zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

* Preparatyka próbek metodą FIB
* Określenie grubości i zawartości pierwiastków warstw nanometrycznych struktury epitaksjalnej fotodetektora supersieciowego
* Obrazowanie STEM w trybie HAADF
* Obrazowanie HR-STEM (HAADF) i HR-TEM z rozdzielczością minimum 75 pm
* Mapowanie EDS z rozdzielczością lateralną wystarczającą do określenia profili zawartości pierwiastków w warstwach o minimalnej grubości 2 nm na przełomie struktur.
* Ilościowe określenie zawartości pierwiastków w wybranych studniach InAsSb
* Poniżej pożądany przykładowy obraz struktury:



1. **Termin wykonania zamówienia**

40 dni od dnia zawarcia umowy.